

Институт химии поверхности
АН УССР
Киев

Получено 13.04.1989
Принято к печати 14.11.1989

ФТП, том 24, вып. 3, 1990

МАГНИТОФОНОННЫЕ ОСЦИЛЛАЦИИ ПРОВОДИМОСТИ С ЧАСТОТОЙ КОРОТКОВОЛНОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО ФОНОНА ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ ПОЛУПРОВОДНИКА

Блох М. Д.

Обычные магнитофононные осцилляции Гуревича—Фирсова [1] имеют частоту длинноволнового оптического фона. Малый волновой вектор фона обусловлен законом сохранения импульса вдоль магнитного поля, обеспечивающим резонансный переход электрона между основаниями подзон Ландау. Однако вблизи границы полупроводника — около поверхности, в области гетероперехода, в пленке — трансляционная симметрия отсутствует и не заставляет сохранения попаречного к границе импульса в акте электрон-фононного взаимодействия. Поэтому в нормальном к поверхности раздела квантующем магнитном поле резонансный переход электрона возможен и с участием (испусканием или поглощением) коротковолнового акустического фона — коротковолновый магнитофононный резонанс (КВМФР). Характерная частота такого резонанса соответствует частоте акустического фона в особой точке фононного спектра.

Вычислим резонансный вклад в проводимость невырожденных электронов вдоль поверхности раздела в попаречном к ней магнитном поле $\mathbf{H}=(0, 0, H)$. Чтобы учесть границу, матричный элемент электрон-фононного взаимодействия будем вычислять с волновыми функциями, z -я часть которых имеет вид $\sin(k_z z + \phi)$. Здесь фаза ϕ , вообще говоря, зависит от импульса электрона k_z вдоль магнитного поля. При малых k_z , актуальных в КВМФР, будем считать что ϕ принимает некоторое конечное значение ϕ_0 , определяемое моделью потенциала границы. С учетом того, что для проекций импульсов резонансных фононов q_z и электронов в начальном k_z и конечном k'_z состояниях имеет место неравенство $q_z \gg k_z, k'_z$, получим для осциллирующей части двумерной проводимости вдоль границы

$$\sigma = \frac{8 \sin^2 \varphi_0 e^2 m^2 n l^4}{\sqrt{\pi} \hbar^2 (2mT)^{3/2}} \sum_{n, n'} \exp \left[-\frac{(n - n') \hbar \omega_c}{T} \right] \int d^3 q \frac{V |c_q|^2}{(2\pi)^3} (n_q + 1) \times \\ \times I_{nn'}(u) \left(\frac{q_y}{q_z} \right)^2 \exp \left(-\frac{\hbar \Delta_{nn'}^q}{2T} \right) K_0 \left(\frac{\hbar |\Delta_{nn'}^q|}{2T} \right),$$

где n — концентрация электронов, l — магнитная длина, n_q — числа заполнения фононов, V — объем системы, ω_c — циклотронная частота, c_q — фурье-образ потенциала электрон-фононного взаимодействия, $I_{nn'}(u) = e^{-u} u^{n-n'} [L_N^{n-n'}(u)]^2$, $u = \frac{1}{2} (q_z l)^2$, $q_\perp = (q_x, q_y)$, L_N^u — нормированный полином Лагерра, $K_0(x)$ — функция Макдональда, $\Delta_{nn'}^q = \omega_q - (n - n') \omega_c$, ω_q — частота акустического фона вблизи особой точки спектра.

Выражение (1) позволяет оценить величину проводимости в условиях КВМФР по сравнению с аналогичной величиной при длинноволновом МФР. Для этого надо знать вид c_q при больших q , который можно найти, используя

метод псевдопотенциала. В этом методе c_q выражается через псевдопотенциал отдельного иона, выбирая который в простой локальной форме Хейне—Абренкова [2], получим

$$|c_q|^2 = \frac{(2\pi)^3}{V} \frac{\hbar e^4}{\pi \rho} \frac{\left[\sum_s Z_s \Omega_s^{-1} F_s(q) \cos(\mathbf{q}, \mathbf{e}_q^s) \right]^2}{\omega_q q^2}, \quad (2)$$

где ρ — плотность кристалла, Z_s — заряд s -го иона элементарной ячейки, Ω — объем на один ион, \mathbf{e}_q^s — вектор поляризации, $F_s(q) = [\epsilon(q) q R_s]^{-1} \times \times \sin q R_s$, $\epsilon(q)$ — диэлектрическая проницаемость, R_s — подгоночный параметр модели псевдопотенциала, табулированный в [2]. При актуальных в КВМФР величинах $q \approx \pi/a$ (a — постоянная решетки) из [2] имеем, например, для GaAs $\epsilon(q) \approx 1$, $q R_s \leqslant 0.7$, поэтому для упрощения положим $F_s(q) = 1$. Сравнивая (2) с $|c_q|^2$ для длинноволновых оптических фононов [1] с $q \sim l^{-1}$, находим, что во всяком случае для основных полупроводников Al_{III}Br_V они одного порядка при $H \approx 10^4 \div 10^5$ Э.

Определенная малость проводимости при КВМФР может быть связана с тем, что в знаменателе подынтегрального выражения (1) содержится большой множитель q^2 , происходящий от того, что поверхность не слишком хорошо рассеивает большой фононный импульс. Однако указанная малость может компенсироваться большим фазовым объемом фононов, участвующих в резонансе. Такая ситуация реализуется в соединениях Al_{III}Br_V, у которых для нижней TA-ветви на большой части зоны Бриллюэна можно считать $\omega(\mathbf{q}) \approx \omega_0$ [3], причем ω_0 слабо зависит от кристаллографического направления. Магнитофононные осцилляции проводимости с такой частотой ω_0 должны иметь наибольшую амплитуду. Сравним величины эффектов КВМФР и МФР для таких бездисперсных фононов. Для этого оценим отношение двумерной проводимости (1), пересчитанной на трехмерную (т. е. деленную на размер образца d поперек границы), к соответствующему выражению из работы [1]. В результате получим $\sigma_{\text{КВМФР}}/\sigma_{\text{МФР}} \sim l/d$, что фактически означает отношение числа электронов, чувствующих несохранение импульса в КВМФР, к полному числу электронов в объеме. Полученная оценка дает максимальную величину эффекта, так как для фононов с дисперсией вблизи особых точек спектра результат уменьшается [4]. Таким образом, рассматриваемый резонанс наиболее заметен в тонких слоях. Так, для КВМФР с участием фононов нижней ветви в кристаллах Al_{III}Br_V при $H \approx 10^4$ Э, $d \approx 0.1$ мкм отношение $\sigma_{\text{КВМФР}}/\sigma_{\text{МФР}} \approx 0.25$. При еще меньшей толщине отношение эффектов, по-видимому, может стать порядка 1, но тогда следует учесть размерное квантование и требуется иное рассмотрение.

Особо выделим анизотропию КВМФР: в резонансе участвуют только те фононы, волновые векторы которых соответствуют особым точкам, расположенным вдоль направления магнитного поля. Действительно, так как $q \sim a^{-1}$, а $q_1 \sim l^{-1}$, то $q_2 \gg q_1$.

В заключение вышепоминавшем зависимость поверхностной проводимости от магнитного поля и температуры вблизи M -го резонанса, при котором $\hbar |\Delta_M| \ll \hbar \omega_0$, $\Delta_M = \omega_0 - M \omega_c$,

$$\sigma_M \propto (M+1) (TH)^{-3/2} e^{-\frac{\hbar \omega_0}{T}} \ln \frac{4T}{\hbar |\Delta_M|}. \quad (3)$$

Автор благодарен М. В. Энтину за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Гуревич В. Л., Фирсов Ю. А. // ЖЭТФ. 1961. Т. 40. В. 4. С. 199—213.
- [2] Хейне В., Коэн М. Л., Уэйр Б. Теория псевдопотенциала. М., 1973. 557 с.
- [3] Mitra S. S., Massa N. E. // Handbook on Semiconductors. V. 1. / Ed. by T. S. Moss. Amsterdam, 1982. 81 р.
- [4] Блох М. Д., Лешко О. М., Шерегий Е. М. // Письма ЖЭТФ. 1988. Т. 48. В. 4. С. 215—217.

Получено 12.06.1989
Принято к печати 14.11.1989